

LA TECNOLOGÍA ICP-OES DUAL VIEW MINIMIZA LA ESPERA

The Measure of Confidence

ICP-OES Agilent 5100



El sistema ICP-OES más rápido que existe

El sistema ICP-OES Agilent 5100 con Dual View (visualización doble) vertical sincrónica (SVDV) ha revolucionado el análisis ICP-OES. Gracias a su exclusiva tecnología de combinador espectral dicróico (DSC), ahora puede realizar análisis en visión axial y radial al mismo tiempo.

Ahorre tiempo y dinero

- Realice análisis ICP-OES con gran rapidez y menor consumo de gas.
- Obtenga todas las líneas de emisión en una sola lectura y consiga mayor precisión en menos tiempo.
- Comience a trabajar antes gracias al detector Vista Chip II que no consume argón y reduce el tiempo de calentamiento.

Rendimiento constante

- Mida las muestras más complejas con una antorcha vertical.
- Consiga una mayor estabilidad analítica a largo plazo gracias a un nuevo generador de RF de estado sólido.

Simplifique sus análisis

- Elimine incertidumbres en el desarrollo de métodos gracias al intuitivo software ICP Expert y a la tecnología DSC.
- Los potentes algoritmos de software simplifican el desarrollo de métodos, mejoran la precisión y permiten ampliar el intervalo de medida.

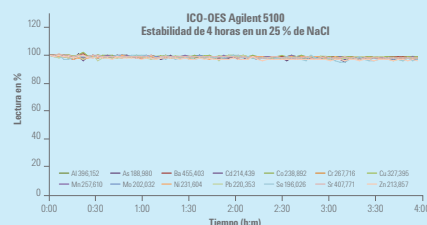
Configuraciones flexibles

Existen tres configuraciones distintas para el sistema Agilent 5100:

- Dual View (visualización doble) vertical sincrónica.
- Dual View (visualización doble) vertical.
- Visión radial.

ROBUSTO Y ESTABLE

El sistema ICP-OES 5100 incluye una antorcha vertical y un robusto sistema de RF de estado sólido en todas las configuraciones, lo que le permite analizar con facilidad las muestras más complejas.



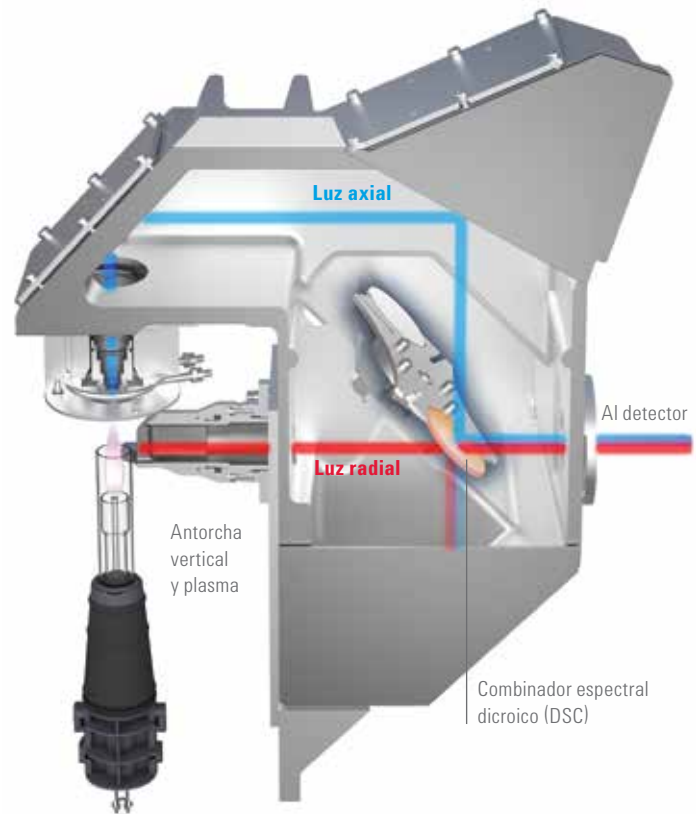
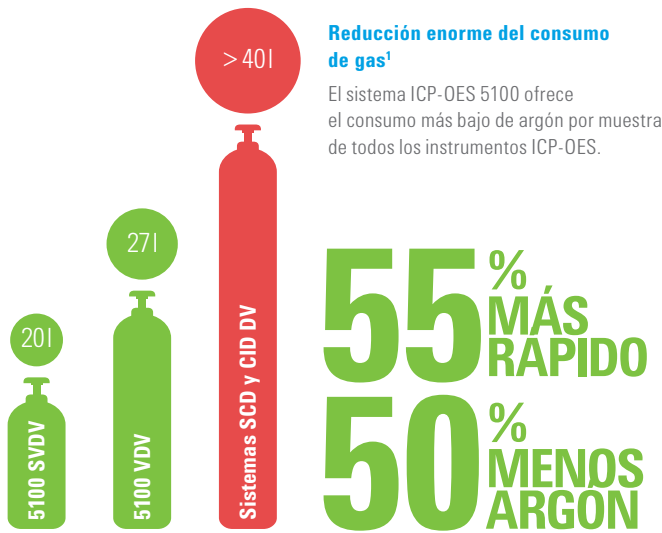
En la imagen se muestran las lecturas expresadas en forma de porcentaje de diversos elementos en una disolución con un 25 % de NaCl. La estabilidad de la lectura de todos los elementos presentó una RSD inferior al 1,3 % durante más de 4 horas (sin patrones internos).



Agilent Technologies

¿Cómo funciona la tecnología Dual View (visualización doble) vertical sincrónica?

El sistema ICP-OES 5100 SVDV únicamente necesita realizar una medida por muestra. El combinador espectral dicróico permite capturar las visiones axial y radial del plasma en tan solo una lectura y obtener resultados precisos en el mínimo tiempo posible¹.



SABÍA QUE...

Los sistemas ICP-OES con Dual View (visualización doble) convencionales exigen configurar una serie de medidas secuenciales y seleccionar qué elementos deben medirse en modo axial y cuáles deben medirse en modo radial.

Algunos sistemas también utilizan dos rendijas para medir las longitudes de onda bajas y altas en cada modo, lo que da lugar a hasta cuatro medidas secuenciales por muestra y hace que el análisis de las muestras se ralentice.

1. Los valores de velocidad del análisis y consumo de gas se han comparado con los de los sistemas de la competencia tomando como referencia los datos publicados sobre aplicaciones. Consulte la nota de aplicación 5991-4821EN de Agilent.

Para obtener más información:
Contacte con su representante local de Agilent o visite www.agilent.com/chem/5100icpoes

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2014
Publicado el 1 de julio de 2014
5991-4835ES

